文章编号:1000-7032(2015)11-1325-05

# 基于数字微镜阵列光调制的激光防护系统

佟 洋,徐熙平\*

(长春理工大学光电工程学院,吉林长春 130022)

**摘要:**提出一种基于数字微镜阵列(DMD)的激光防护系统设计方案,利用 DMD 的光调制作用减少强激光对 光电成像设备的损坏。详细介绍了系统的工作原理、DMD 及 CCD 的选型、投影光路和光学转换系统的设计, 运用相移莫尔法进行了图像像素的调校。模拟实验结果显示,该系统可在不同光斑半径和光强的条件下成 功识别激光光斑中心点的像素坐标和半径,实现对光斑对应区域的微反射镜控制,激光光强可衰减 70% 以上。

**关 键 词:**数字微镜阵列;激光防护;莫尔相移法 中图分类号:TN216 **文献标识码:** A **DOI**: 10.3788/fgxb20153611.1325

## Protection System for Optoelectronic Sensors Against Laser Radiation Based on Light Modulation of DMD

TONG Yang, XU Xi-ping\*

(School of Opto-electronic Engineering, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China) \* Corresponding Author, E-mail: xxp@ cust. edu. cn

**Abstract**: A design scheme of laser protection system based on digital micro-mirror device (DMD) was proposed to reduce the damage of intense laser to optoelectronic imaging equipment. The working principle of the system, the model selection of DMD and CCD, the projection optical path and the design of optical conversion system were introduced in detail. The image pixels were tuned by using the phase-shifting Mohr method. The simulation results show that the system can successfully identify pixel coordinates and radiuses of the laser spot center points in different spot radiuses and light intensities, and achieve micro-mirror control of the corresponding regions of spots. The laser light intensity can be attenuated by over 70%.

Key words: DMD module; protection system against laser radiation; phase-shifting Moire method

1引言

近年来,随着光电技术的迅猛发展,光电成像 技术成为重要的制导方式。由于该类设备中的光 传感器等元件往往具有累计增益,因此容易受到 高强度激光的辐射而损坏。为保持光电设备的稳 定运行,必须采取有效的激光防护措施。

激光防护技术主要分为基于光学相变、线性 光学和非线性光学原理的三大类<sup>[1]</sup>。主要形式 有薄膜吸收或反射<sup>[24]</sup>、光谱滤波、光限幅技 术<sup>[5-10]</sup>、光学开关技术等。本文提出了一种基于 数码微镜阵列的激光防护方案,该方案运用光学

收稿日期: 2015-08-13;修订日期: 2015-09-19 基金项目: 国家自然科学基金(YYWX\_E12102791-201304)资助项目

开关技术,通过改变微镜的反射角度和反射时间 达到限制进入光电设备的激光强度的目的,有效 地抑制了光饱和现象,实现了抗激光辐射的效果。

### 2 系统设计

基于微镜阵列的激光防护系统结构如图1所示。该系统主要由光学投影系统、DMD组件、光 学转换系统、CCD模块、CPU控制器以及各种接 线组成。含有自然光和强激光的混合光进入投影 系统,经调整对准到DMD的反射镜面;反射后的 光进入光学转换系统,投射到CCD相机;采集的 图像信息送至CPU进行运算,确定图像的光强饱 和中心和半径,将对应的微镜控制信息传回 DMD,实现强激光的光强衰减功能。由于系统中 的CCD的过曝光可以通过调节CCD的曝光时间 予以消去,而激光的作用是无法消除的,因此对 CCD曝光的调节可以区分是否为激光导致的过 饱和。



图 1 系统原理图,其中实体箭头表示光路,空心箭头表 示电路连接线或信号连接线。

Fig. 1 Block diagram of the protection system against laser radiation. Solid arrows indicate the light path, and hollow arrows are electronic or digital connections.

#### 2.1 DMD 组件与 CCD 相机

DMD 是一种数字调控的光开关器件,采用二 进制脉宽调制,实现光的振幅、相位和反射方向的 调整。每个 DMD 芯片上集成了数以万计的微反 射镜,单个镜片可绕对角线进行 ±12°的轻微转 动,并可以独立控制。本系统通过控制微镜的偏 转角度来实现对光线方向的控制。

DMD 组件是本系统实现激光防护功能的核 心器件,因此必须对它的分辨率、控制精度以及响 应速度等参数进行优选。综合各个参数,本系统 选用了 XD-SD02 的 DMD 组件。它的分辨率为 1 024 × 768像素,像元尺寸为 13.68 μm。它有 3 个状态:"on"、"off"、"flat",分别对应微镜的 3 个 角:+12°、-12°和 0°。其中,DMD 的"flat"状态 为未上电的初始状态,它不是一个可控的稳定状 态。上电后,对 DMD 的控制只有两种状态:"on" 和"off"。具体参数见表 1。

为了提高激光防护系统的分辨率,需要实现 CCD 相机与 DMD 组件的像元对应性,而相机的 帧频也是本系统实现高性能激光防护的重要条 件。因此,我们选择像素高以及与 DMD 帧频差 5~10倍的相机型号。本设计中选取了约 140 兆 像素的 CCD-ICX285AL,参数详见表 1。

表1 DMD 组件和 CCD 相机的具体参数

Table 1 Specifications of DMD & CCD

参数	DMD	CCD	
光学尺寸	14.008 mm×10.506 mm	10.2 mm × 8.3 mm	
全部像元	$1 024 \times 768$	1 431 ×1 050	
像元尺寸	13.68 μm × 13.68 μm 6.45 μm × 6.45 μm		
斜边尺寸	17.51 mm	17.51 mm 11 mm	
帧频	150 Hz	15 Hz	
工作波段	350 ~ 700 nm	$400 \sim 800 ~\rm{nm}$	

## 2.2 投影系统与光学转换系统

本系统的光学设计部分包括投影系统和光学 转换系统,用以实现光学引擎功能。考虑投影图 像的均匀性,降低能量耗损,保证成像质量,避免 投影系统与光学转换系统的光机结构相互制约的 问题,本设计采用了带有 TIR 棱镜的远心光路,根 据全反射性质,精确设计对应倾斜边的角度,实现 了光线的控制,如图 2 所示。





含有自然光和激光的混合光线通过投影系统 光路进入到 TIR 棱镜,通过棱镜 1 倾斜边界全反 射到 DMD 反射镜面。根据 DMD 的不同状态,反 射后的光线分别进入不同的反射棱镜:"on"状态 下,反射光线进入棱镜2,直接透射出去进入光学转换系统和 CCD 相机;"off"状态下,DMD 反射的 光线进入棱镜3,并经再次全反射出去并用暗板 接收,远离光学转换系统,避免干扰。

根据选定的 DMD 组件以及 CCD 相机的尺 寸,光学转换系统的垂轴放大倍率为

$$\lambda = \frac{8.3}{10.506} \approx 0.79, \qquad (1)$$

考虑到加工误差及分光精度,设 DMD 反射后的 光锥角为 $\beta' \approx 11^\circ$ ,则 CCD 表面光束的光锥角  $\beta \approx 8.7^\circ$ 。若取光学转换系统的像方孔径角为  $8.5^\circ$ ,则物方孔径角约为10.7°。

3 像素调校

由于 CCD 和 DMD 的像元非常微小,像元的

阵列也并不相同,因此要实现系统的闭环控制功能,需要对两个元件间的图像传递通信进行校对。 本文采用了基于相移莫尔法的像素通信调校方法,该方法通过莫尔条纹图案的相位分布辨别像 素是否匹配,并且能够提供像素的错位补偿。该 方法易于实行,并具有较高的精度<sup>[11-12]</sup>。

对于已经校正畸变的系统,以 40  $\mu$ s 的数字 信号控制 DMD,通过 CPU 控制 DMD 以行或列为 单位的"on"和"off"态,产生以  $N(N \ge 4)$  像素为 周期的二进制明暗相间条纹。以 1/N 的像素进 行图像采集并复制,循环 N 次。将 N 幅图像进行 对比,若出现了莫尔条纹,则 DMD 与 CCD 像元不 匹配,需进行修正。N 为8 时,像元对应与像元错 位情况分别如图 3 和图 4 所示。

相移的图像中单个像元接收的光强度表示







如下:

$$I_n(x,y) = I_p(x,y) + I_q(x,y) \cdot$$

 $\cos[\theta(x,y) + 2\pi/n]$  *n* = 0,1,…,7, (2) 其中,*I*<sub>p</sub>(*x*,*y*)表示图像的背景强度,*I*<sub>q</sub>(*x*,*y*)是光 栅的振幅强度, $\theta(x,y)$ 是相位初始值。莫尔条纹 的相位公式如下:

$$\tan\Delta\theta(x,y) = \frac{I_n(x,y) - I_{n-2}(x,y)}{I_{n-3}(x,y) - I_{n-1}(x,y)}, \quad (3)$$

若图像分析区有相位差大于 2π/N,说明有像素 错位或失配,其量值为

$$m = \frac{d\Delta\theta}{2\pi},\tag{4}$$

其中,d是标准莫尔图案的栅距。

#### 4 测试结果

在实验室环境中,采用微型可见绿色激光器 (MLL-Ⅲ型,波长532 nm)作为光源,模拟激光干 扰。在光斑半径 2 nm、功率 2 mW 的激光照射 下,CCD 相机采集的图像如图 5(a)所示。进而 识别饱和光斑中心并确定半径。CCD 图像采集 速度为15 F/s,提取的结果为:激光光斑中心像素 坐标(383,480),光斑半径 153 像素,光强被衰减 了70.1%。根据该结果,将对应编码位置的微镜 状态设置为"off"。经 DMD 调制后,饱和区的激 光光线被反射到 CCD 视场以外,显示为黑色。



- 图 5 模拟实验结果。(a)调制前图像;(b)调制后图像。
- Fig. 5 Result of simulation experiment. (a) Image without modulation by DMD. (b) Image with modulation by DMD.

效果如图 5(b) 所示。接着,我们对不同光强以 及不同光斑直径激光的干扰性能进行了测试,结 果如表 2 所示。

## 表 2 不同光斑直径和光强条件下的防激光性能测量实 验结果

 
 Table 2
 Results of experiment about the protection function under different radius and intensities of laser light

激光光斑半径/ mm	激光光强/ mW	CCD 检测 光斑直径 (像素)	滤除光强比率/ %
1	1	77	77.9
1	1.5	78	77.8
1	2	80	78.5
1	2.5	81	79.2
1	3	84	80.1
1.2	2	99	77.6
1.4	2	112	76.2
1.6	2	127	74.5
1.8	2	140	73.3
2	2	153	70.1

从实验结果可知,在光斑直径一定的情况下, 激光的功率越大,系统能够衰减的激光光强比率 就越高;在光强一定的条件下,光斑直径越大,激 光光强衰减比例就越小。对实验结果进行总结分 析可知,单位面积上的光强越大,CCD 相机采集 的图像辨识度越高,系统的防护性能就越好。

## 5 结 论

针对激光防护安全的需求,提出一种基于数码 微镜阵列的激光防护系统方案,包括投影系统、 DMD 组件、光学转换系统以及 CCD 相机。根据莫 尔相移法对 DMD 和 CCD 的像元匹配进行了校对, 并在不同光斑半径和光强条件下对该系统的防护 性能进行了模拟实验测试。实验结果表明,该系统 能够将进入 CCD 视场的激光光强衰减掉 70% 以 上,并且光强密度越大,系统的防护性能越好。

#### 参考文献:

- [1] Meng X F, Lu C H, Ni Y R, et al. Application and protection of laser technology [J]. Infrared Laser Eng. (红外与激光 工程), 2005, 34(2):136-141 (in Chinese).
- [2] Shen Z F. Preparation of specific refractive index material and optical thin films [J]. *Chin. Opt.* (中国光学), 2013, 6 (6):900-905 (in Chinese).
- [3] Chen M, Ma S J, Li C F, et al. Eye-protection glasses against YAG laser disservice based on the bandgap reflection of

one-dimensional photonic crystal [J]. Chin. J. Lumin. (发光学报), 2004, 25(3):325-328 (in Chinese).

- [4] Shi P, Fu X H, Sun Y, et al. Design and fabrication of double wavelength laser protective infrared antireflection coatings [J]. Chin. J. Lasers (中国激光), 2011, 38(4):182-186 (in Chinese).
- [5] Chen Z H, Xiao S, He J, *et al.* Ultrafast optical nonlinearities in GaAs at telecommunication wavelengths [J]. *Chin. J. Lumin.* (发光学报), 2015, 36(8):969-975 (in Chinese).
- [6] Qu S L, Du C M, Song Y L, et al. Nonlinear refraction and optical limiting in the nanocomposite based on C<sub>60</sub> structured system with gold nanoparticles [J]. Chin. J. Lasers (中国激光), 2002, 29(4):335-338 (in Chinese).
- [7] Song H L, Yan L H, Si J H, et al. Optical limiter for ultrashort laser pulses based on ultrafast optical Kerr effect [J]. Chin. J. Lasers (中国激光), 2015, 42(2):0217002-1-6 (in Chinese).
- [8] Soon B Y, Haus J, Scalora M, et al. One-dimensional photonic crystal optical limiter [J]. Opt. Express, 2003, 11(17): 2007-2018.
- [9] Venkatram N, Kumar R S S, Rao D N. Nonlinear absorption and scattering properties of cadmium sulphide nanocrystals with its application as a potential optical limiter [J]. J. Appl. Phys., 2006, 100(7):074309-1-7.
- [10] Huang Y, Siganakis G, Moharam M G, et al. Broadband optical limiter based on nonlinear photoinduced anisotropy in bacteriorhodopsin film [J]. Appl. Phys. Lett., 2004, 85(22):5445-5447.
- [11] Saldner H O, Huntley J M. Profilometry using temporal phase unwrapping and a spatial light modulator-based fringe projector [J]. Opt. Eng., 1997, 36(2):610-615.
- [12] Kakunai S, Sakamoto T, Iwata K. Profile measurement taken with liquid-crystal gratings [J]. Appl. Opt., 1999, 38 (13):2824-2828.



**佟洋**(1975 -),男,辽宁兴城人,博 士研究生,2003 年于东北师范大学 获得硕士学位,主要从事 DMD 调 制成像系统的研究。 E-mail: TongYang2002@163.com



**徐熙平**(1969-),男,吉林人,教授,博 士生导师,2004 年于长春理工大学获 得博士学位,主要从事光电检测技术 与质量控制方面的研究。 E-mail: xxp@ cust. edu. cn